

2016年11月25日

TOF-SIMS 分析用有機膜付きシリコン試料調達に関する仕様

一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会

本仕様は下記仕様を満たす分析用試料を納入できる機関を公募するに際して適用するものです。
納入を希望する機関は5項に示す期限までに当協会担当者に連絡をお願いします。

1. 適用

当協会の指定する分析用試料を納入していただきます。

2. 試料仕様

基板; 4インチ Si 基板

膜; ZEP 極薄膜、ZEP 超薄膜、ZEP 薄膜(金属下地なし)

膜; ZEP 極薄膜、ZEP 超薄膜、ZEP 薄膜(金属下地あり)

計 6 種類

3. 納入個数及び形態

個数; 10mm角試料 計60個 (上記各 Si 基板より10個)

形態; 個包装

4. 希望納期

平成 29 年 2 月 28 日

5. 見積もり書提出期限

平成 28 年 12 月 2 日 17:00 までに下記まで連絡のこと。

担当:一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 調査研究部 嵩 比呂志

連絡先:東京都文京区本郷 3-23-1 クロセビア本郷ビル2F

TEL 03-3868-0826、E-mail suu@jria.or.jp

以上